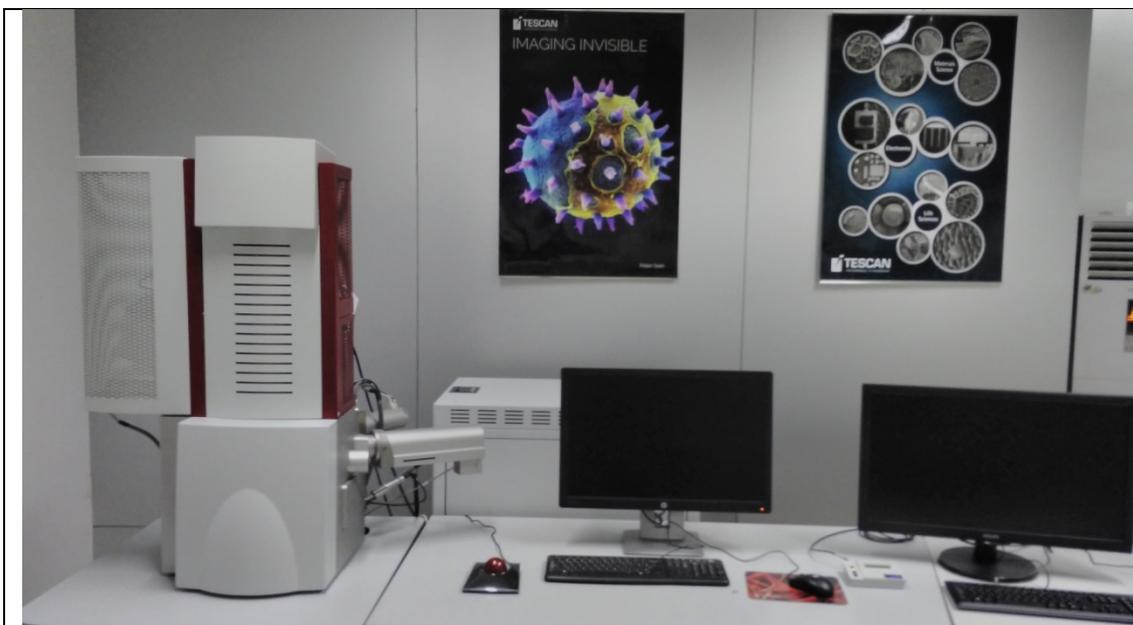
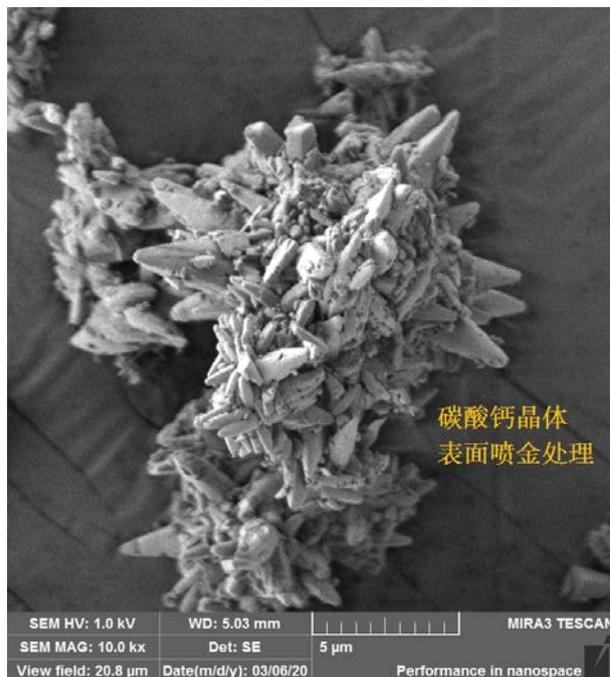
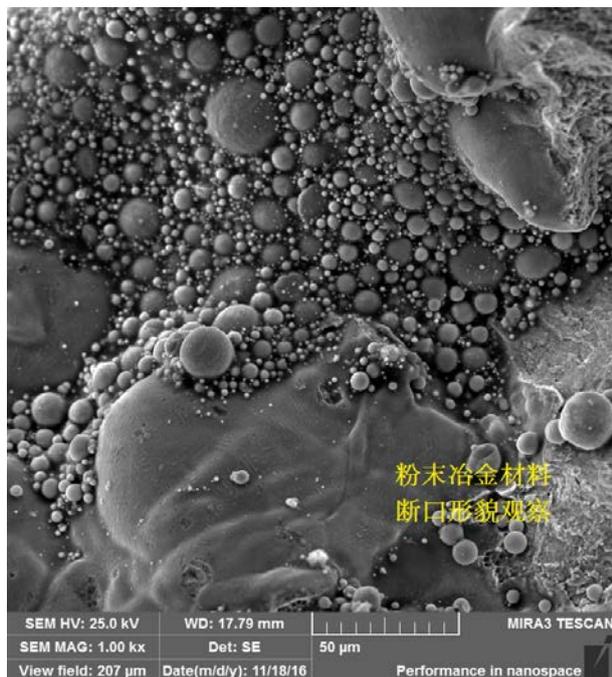


热场发射扫描电子显微镜（含能谱仪）

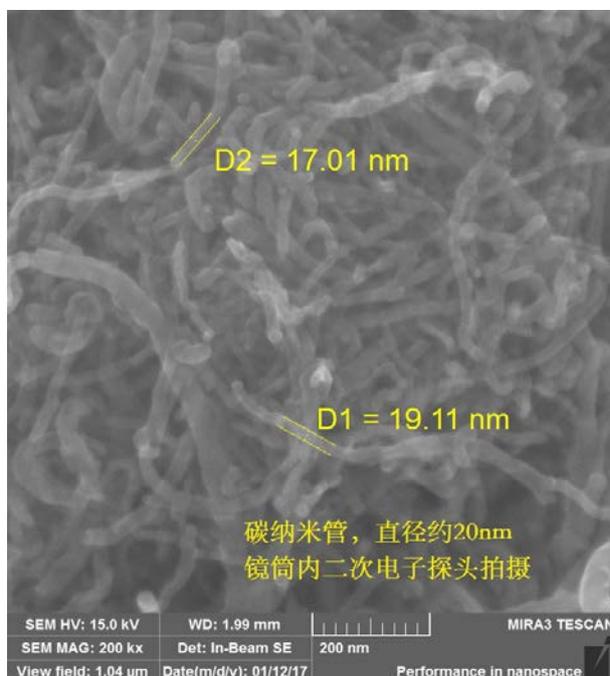
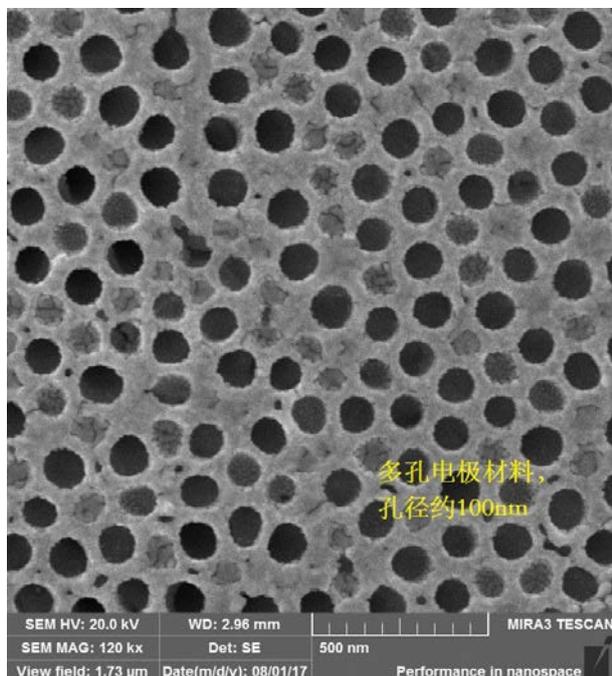


| | | | |
|------|--|----|-------|
| 仪器名称 | 热场发射 扫描电子显微镜 | 编号 | W166 |
| 厂商国别 | 捷克 TESCAN | 型号 | MIRA3 |
| 主要用途 | 该电镜用于分析和观察样品表面及近表面形貌及结构；其较高的电子束流，与 X 射线能谱仪相结合，可对固体材料的表面涂层、镀层进行成分及层厚分析，进行材料表面微区成分的定性和半定量分析，在材料表面做元素的面、线、点分布分析。 | | |
| 技术指标 | 二次电子像分辨率：1.0nm（30kV），3.5nm（1kV） 着陆电压：0.2 ~ 30kV/减速模式下 0.05 ~ 30kV 电子束流：最大可达 200nA 图像放大倍数：1~1000,000× 样品仓：可装载样品最大直径 200mm，样品台承重 8Kg 探测器：普通及 In-Beam 二次电子（SE）探测器 普通及 In-Beam 背散射电子（BSE）探测器 | | |
| 主要附件 | 牛津 X-MaxN 50 电制冷能谱仪 主要技术指标：窗口 50mm ² 活区，实际晶体面积 100mm ² 分辨率：MnK α 优于 127eV 元素探测范围：Be4-Cf98 | | |

微观分析案例 1 (低倍、大景深)



微观分析案例 2 (高分辨率)



X 射线衍射仪

| | | | |
|------|--|----|------------|
| 仪器名称 | X 射线衍射仪 | 编号 | W165 |
| 厂商国别 | 日本 RIGAKU | 型号 | SmartLab 3 |
| 主要用途 | 物相定性分析 | | |
| 技术指标 | 最大功率: 3kW 测角 (2θ) 重复性: 0.001° 测角精度: $\Delta 2\theta \leq \pm 0.02^\circ$ | | |



X 射线荧光波谱仪

| | | | |
|------|--|----|---------------------|
| 仪器名称 | X 射线荧光波谱仪 | 编号 | W181 |
| 厂商国别 | 美国赛默飞 | 型号 | ARL PERFORMX4200 |
| 主要用途 | 化学成分分析、Rohs 检测 | | |
| 技术指标 | 元素分析范围：O8-U92 X 射线管：Rh 靶 X 射线管，最大允许电压 70kV，最大允许电流 140mA，最大允许功率：4.2kW 测角仪：全数字控制测角仪，最大线性计数 1500kcps 准直器：超粗 2.6° 准直器用于轻元素分析，粗 1° 准直器、中 0.4° 准直器用于常规分析，细 0.15° 准直器用于重元素分析 | | |



能力验证满意证书

